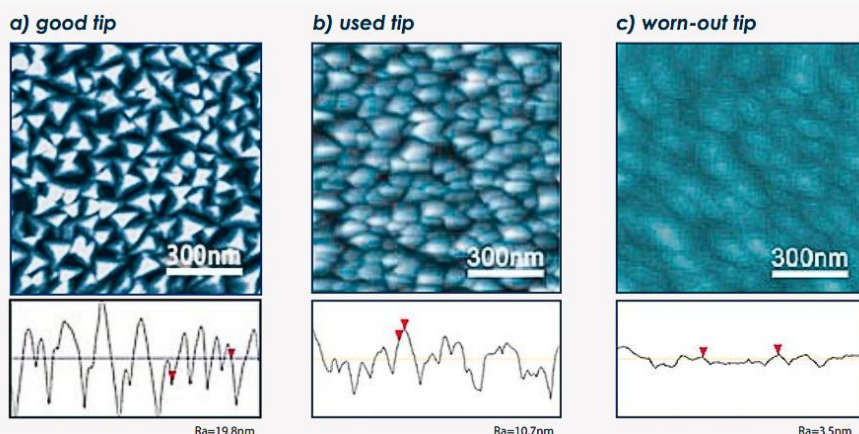


TipCheck AFM ティップチェックサンプル

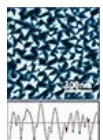
イントロダクション

AFM による試料表面を撮像する場合、表面のイメージが正確に得られているか、または ティップの先端が鈍くなっているか、もしくは、破損されている影響を受けているかどうかを知ることは困難です。ティップ先端の鈍化または破損は表面粗さや寸法などの測定値を大きく歪めます。適切な AFM ティップで測定するために、ティップを定期的に交換するか、または SEM イメージによってティップ先端を確認しなければなりません。これらの方法には時間と費用がかかります。これらの問題を解決するために、迅速かつ便利なティップチェックサンプルを用いた AFM ティップ先端コンディション検査をお勧めいたします。AFM チップの状態を明確にするためにはシングルスキャンのデータを測定することで十分だとよく言われています。Tipcheck AFM ティップチェックサンプルを用いることで、AFM プロブの頂点、形状やシャープネスなどのパラメータを迅速かつ簡単な方法で比較・分類することができます。鈍化や破損の検査のため、画像全体をスキャンしたり、先端の SEM 検査を行う必要なく、簡単に AFM チップが使用可能かどうかの確認をすることができます。また、ティップチェックサンプルは現在市場で入手可能なティップキャラクタリゼーションソフトウェア利用者から高評価を得ています。



ティップチェックサンプルを用いた異なるチップ条件の比較。 スキャンサイズ: 1x1 μ m 高さ: 100nm

TipCheck サンプルは、シリコンチップ上に堆積された耐摩耗性の高い薄膜コーティングで構成されています。薄膜は粒状、AFM プロブの先端頂点のリバースイメージに理想的な鋭くとがったナノ構造体を示しています。 サイズ : 5x5mm 12mm 金属 AFM ディスク上に導電性エポキシ樹脂で固定



TipCheck AFM tip test sample on 12mm AFM disc

パーツ番号 34-020001 1 枚 価格 ¥57,800

本内容は予告なしに変更されることがございます。

〒124-0012 東京都葛飾区立石 3-15-4

TEL:03-6379-4105 FAX:03-6379-4106

www.elminet.co.jp CN:TipCheck 1610A